

## 2024年度 機器利用講習会・説明会

申込書を各担当者へメールでお送り下さい

### 【NMR】

超高分解能核磁気共鳴装置 (ECAシリーズ 及び Lambda500)	
内容:	<sup>1</sup> H NMR測定方法
料金:	無料
講師:	藤高 仁(技術職員)
実施期間:	5月8日(水)~6月7日(金)
場所:	機器分析J棟101室
備考:	"NMR講習2024.xlsx" に必要事項を記入し、直接藤高にご送付ください。
申込先:	fujitak [at] hirosima-u.ac.jp

### 【電子顕微鏡】

電子プローブマイクロアナライザ (JEOL・JXA-iSP100)	
内容:	EPMA分析に関する相談、演示など
料金:	無料
講師:	柴田 恭宏(技術職員)
日時:	5月15日(水) ①10:00-12:00、②13:00-15:00、③15:00-17:00
定員:	各回4人まで
場所:	機器分析J棟306室
申込〆切:	5月7日(火)
申込先:	yasshibata [at] hirosima-u.ac.jp
備考:	<ul style="list-style-type: none"><li>・EPMA未利用で、今後のご利用をお考えの皆さまのお申し込みを特に歓迎いたします。</li><li>・演示は、できる限りユーザー様お手持ちの試料を用いて行います。</li><li>・今回の講習会の受講は、新規のEPMA利用の必須要件ではありません。</li></ul>

超高分解能電界放射型走査型電子顕微鏡 (FE-SEM)	
内容:	初めて装置を扱う人向けの講習会
料金:	有料(相互利用として取扱います。2時間で1000円)
講師:	前田 誠(技術職員)
日時:	5月20日(月)~24日(金) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員:	各回6人まで
場所:	機器分析J棟103室
申込〆切:	5月14日(火)
申込先:	mmaeda [at] hirosima-u.ac.jp
備考:	講習会受講後、比較的すぐ(1か月程度のうち)に装置を使う予定のある人のみ受講して下さい

## 【電子顕微鏡】

超高分解能透過型電子顕微鏡 (TEM)	
内容：	これから依頼分析を利用したい人向けの装置紹介、並びに試料準備方法の紹介
料金：	無料
講師：	前田 誠(技術職員)
日時：	6月17日(月)~6月21日(金) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員：	各回5人まで
場所：	機器分析J棟103室
申込〆切：	6月11日(火)
申込先：	mmaeda [at] hirosima-u.ac.jp
備考：	講習会受講後、比較的すぐ(1か月程度のうち)に装置を使う予定のある人のみ受講して下さい。自分で透過型電子顕微鏡を操作したいという方は、別途担当者に相談して下さい。

New	集束イオンビーム (FIB-SEM, Helios G4)
内容：	イオンビームを用いてできることの紹介・デモ、試料の準備方法などを解説
料金：	無料
講師：	前田 誠(技術職員)
日時：	5月27日(月)~5月31日(金) 各日10:00-12:00, 14:00-16:00の2回開催
定員：	各回6人まで
場所：	機器分析J棟103室
申込〆切：	5月21日(火)
申込先：	mmaeda [at] hirosima-u.ac.jp
備考：	観察してほしい試料がある人はお持ちください。基本的に研修室単位で参加して頂きます。3月末に開催したものと内容は同じです。

New	透過型電子顕微鏡 (JEM-1400Plus), クライオ系試料前処理装置
内容：	新規導入された装置群を主に、新しい電顕室を紹介します
料金：	無料
講師：	小池 香苗(技術職員)
定員：	4人まで
場所：	機器分析J棟304室
申込〆切：	なし(随時)
申込先：	koikeka [at] hirosima-u.ac.jp
備考：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧凍結装置EM ICE、クライオウルトラミクロームが設置されました。</li> <li>・今回の講習会では、装置の実際の操作についての講習は行いません。今後のご利用に向けて、試料の準備や測定の前め方などご相談ください。</li> </ul>

## 【質量分析計】

レーザーイオン化飛行時間型質量分析計 (MALDI-8020)	
内容：	MALDI-TOFMS測定の基本操作
講師：	網本 智子 (技術職員)
料金：	無料
日時：	5月7日(火)~10(金) ①10:00-11:00、②13:00-14:00、③15:00-16:00
定員：	各回3人まで
場所：	機器分析J棟108室
申込〆切：	5月1日(水) 17時
申込先：	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	お手持ちの試料があれば、それを実際に分析しながらご説明致します。

高性能ハイブリッド型質量分析システム (LTQ Orbitrap XL)	
内容：	ESI-MS (またはAPCI-MS) 測定及びデータ解析のデモンストレーション
料金：	無料
講師：	網本 智子 (技術職員)
日時：	5月21日(火)~24(金) ①10:00-11:00、②13:00-14:00、③15:00-16:00
定員：	各回5人程度まで
場所：	機器分析J棟108室
申込〆切：	5月15日(水) 17時
申込先：	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	<ul style="list-style-type: none"> <li>・今年度は講習会ではなく、デモンストレーションによる装置説明会とさせていただきます。</li> <li>・詳細な測定手順はご説明しません。利用資格を得ていただくための講習会は、実際の分析試料・ご希望の条件にあわせて改めて有料(相互利用)にて対応させていただきます。</li> <li>・お手持ちの試料があれば、それを実際に分析します。</li> <li>・主に依頼測定をご利用予定の皆様のご参加も歓迎致します。</li> </ul>

ナノ・キャピラリー・マイクロフロー高耐圧液体クロマトグラフィーシステム (nanoLC)	
内容：	タンパク同定のための nanoLC/MS/MS 測定法
料金：	無料
講師：	統合生命科学研究科 中の 三弥子 准教授
日時：	5月27日(月), 28(火), 30(木), 31日(金) 各日 10:30-14:00
定員：	各回5人まで
場所：	機器分析J棟108室
申込〆切：	5月21日(火)
申込先：	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	nanoLC/MS/MS の測定中(1時間程度)は昼休憩とします。 日程調整の都合上、参加可能な日を第2希望までご記入ください。

## 【質量分析計】

New	高性能ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計 (JMS-T2000GC)
内容：	GC/EI-MS測定方法
料金：	無料
講師：	網本 智子 (技術職員)
日時：	6月3日(月)~7(金) ①10:00-12:00、②14:00-16:00
定員：	各回3人まで
場所：	機器分析J棟108室
申込メ切：	5月28日(火) 17時
申込先：	amimoto [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	お手持ちの試料があれば、それを実際に分析しながらご説明致します。 (準備・時間の都合上カラムはHP-5とし、短時間のメソッドを使用させていただきます)
お知らせ：	メーカーによる説明会を開催します <a href="http://kiki.hirosshima-u.ac.jp/News_2024/240411.shtml">http://kiki.hirosshima-u.ac.jp/News_2024/240411.shtml</a>

## 【X線回折】

単結晶X線構造解析システム (リガク製 XtaLAB Synergy R/DW)	
内容：	①WEB講習 (オンデマンド) + ②実機操作 (随時)
料金：	①無料 ②無料 (持ち込み試料は要相談で500円/1時間で実施。測定時間は試料依存で1~36時間程度。)
申込方法	①WEB講習はMoodleで実施します。こちらから受講者を登録しますので、申込書の備考欄にメールアドレスと学籍番号・職員番号 (アドレスに含まれている場合は不要) を全員分記載してください。希望
申込メ切：	随時受付 <b>【重要!】今年度の初回実機操作 (②) の受付は7月末までとします</b>
申込先：	kawata [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	・この講習会の受講は相互利用 (自己測定) の要件となります。 ・今年度は8月~12月の立会測定、依頼測定を休止する予定です。この期間にご利用される可能性がある方は、早めに相互利用の利用資格を取得し、操作法の習熟に努めてください。 ・講習では操作方法の説明を主としており、測定原理や結晶学の基礎には触れませんが、これらの知識は測定・解析時に必須となります。研究分野によっても必要な知識・情報は異なるため、必ず各自でそれぞれに必要な情報を集めてください。講習会マニュアルだけでは情報が不十分ですので、適した専門書をお手元にご準備ください。
担当者：	河田 尚美 (技術職員)

粉末X線回折装置 (リガク製 SmartLab SE)	
内容：	実機講習 (90分)
料金：	無料 (原則として持ち込み試料は受け付けません)
日時：	4月25日(木), 5月9日(木), 5月14日(火), 5月16日(木), 5月21日(火), 5月23日(木) 各日 10:30-12:00 <b>【重要!】今年度は原則として年度途中の臨時講習は実施しません</b>
定員：	各回5人まで
場所：	機器分析J棟307室
申込メ切：	4月22日(月)
申込先：	kawata [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	・この講習会の受講は相互利用 (自己測定) の要件となります。 ・今年度は8月~12月の立会測定、依頼測定を休止する予定です。この期間にご利用される可能性がある方は、早めに相互利用の利用資格を取得し、操作法の習熟に努めてください。 ・講習では操作方法の説明を主としていますので、測定原理等は事前に調べてから来ててください。
担当者：	河田 尚美 (技術職員)

## 【ESR】

電子スピン共鳴装置 (E500)	
内容：	電子スピン共鳴スペクトル(ESR) 測定で分かる事+基本測定講習
料金：	無料
講師：	先進理工系科学研究科 駒口 健治 准教授
日時：	① 5月13日(月) 13:30~17:00 ② 5月14日(火) 13:30~17:00 ③ 5月17日(金) 13:30~17:00 ④ 5月23日(木) 13:30~17:00 4回の講習はすべて同一の内容を行います
場所：	H棟 204室(ESR測定で分かる事)+J棟 109室(基本測定講習)
申込メ切：	5月7日(火)
申込先：	okoma [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	希望日は、可能でしたら第一候補から第三候補までお知らせ頂けると幸いです。 申込者多数の場合には、研究室あたりの人数を制限させていただく場合があります。その際は締切後に連絡代表者の方へご相談をさせていただきます。

## 【微量元素分析】

微量元素分析システム(ハ <sup>o</sup> -キエルマ-2400Ⅱ)…依頼測定用	
内容：	簡易的な装置説明(依頼測定)
料金：	無料
講師：	北野 幸一(技術職員)
日時：	5月14日(火)、28日(火)、6月4日(火) 10:00-11:00
定員：	各回6人まで
場所：	機器分析J棟203室
申込メ切：	5月9日(木) 15時
申込先：	kitanok [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	現在依頼測定のみ受付となっており、装置の簡易的な説明会です。

## 【顕微ラマン】

New	顕微ラマン分光装置(堀場製作所 XPLORA PLUS)
内容：	顕微ラマン分光装置測定方法
料金：	無料
講師：	北野 幸一(技術職員)
日時：	期間 5月8日(水)~6月7日(金)《詳細は申込書参照》
申込書：	申込書"raman_koushu_2024.xlsx"に必要事項を記入し、 <b>直接北野</b> にご送付ください。
定員：	各回4人まで
場所：	機器分析J棟301室
申込メ切：	希望日10日前までの午前中
申込先：	kitanok [at] hirosshima-u.ac.jp
備考：	<ul style="list-style-type: none"> <li>本装置は2023年11月より<b>新規</b>にご利用頂いております。</li> <li>相互利用(直接測定)のみでのご利用です。</li> <li>本講習会を受講頂くことで利用資格を申請頂けます。</li> <li>今年度から長焦点対物レンズ導入にてサンプル間隙を約0.2→3.4mmに拡大済みで、以前より容易にご利用頂けます。</li> <li>お手持ちの試料があれば、講習と合わせて時間内で簡易的に測定致します。</li> <li>機器分析J棟1階にあった従来のラマン分光装置と比較して簡単な操作でご利用頂けますが、測定波長数値の精度は従来機性能に至らない点を踏まえご利用願います。</li> </ul>

## その他、個別にお問い合わせください

円二色性分散計 (日本分光 J-1500型)	
個別に対応しております。以下の担当者までお問合せください	
担当者：	先進理工系科学研究科 平尾 岳大 准教授
連絡先：	thirao [at] hirosima-u.ac.jp

円偏光ルミネセンス測定装置 (日本分光 CPL-200型)	
個別に対応しております。以下の担当者までお問合せください	
担当者：	先進理工系科学研究科 平尾 岳大 准教授
連絡先：	thirao [at] hirosima-u.ac.jp

機器分析J棟の機器はこちらでご紹介しています

[http://kiki.hirosima-u.ac.jp/kiki\\_equip/equip\\_list.shtml](http://kiki.hirosima-u.ac.jp/kiki_equip/equip_list.shtml)